سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
رشد و مشخصه یابی الکتریکی لایه نازک فریت بیسموت با استفاده از روش لایه نشانی لیزری

محل انتشار:
هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:
منصوره کریمی - *پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران*

سیده مهری حمیدی - *پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران*

محمدمهدی طهرانچی - *پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران*

خلاصه مقاله:
مواد مگنتوفروالکتریک به دلیل دارا بودن خواص الکتریکی و مغناطیسی قابل کنترل مورد توجه فراوان قرارگرفته است دراین تحقیق لایه نازک فریت بیسموت با کمک روش لایه نشانی لیزری تهیه شده و به کمک لایه نازک طلا پوشش پذیرفته است مشخصه یابی ساختاری سطح و پسماند الکتریکی این ترکیب با کمک طرح پراش پرتوایکس تصویربرداریمیکروسکوپ الکترونی و چیدمان اندازه گیری خواص الکتریکی مورد تحقیق قرارگرفته است نتایج به دست آمده بیانگر مفید بودن این ترکیبات در کاربردهای حافظه الکتریکی است.

کلمات کلیدی:
فریت بیسموت، لایه نشانی لیزری، پسماند الکتریکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/105277